# Caracterización de fotomultiplicadores de silicio (SiPM) para misión espacial.

Lucas Finazzi Tomás Ferreira Chase

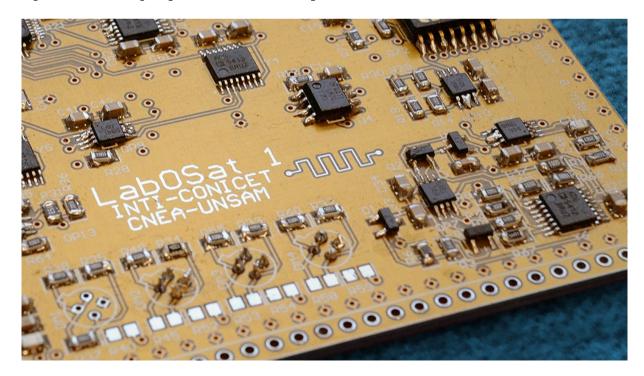
**Director**: Dr. Federico Izraelevitch





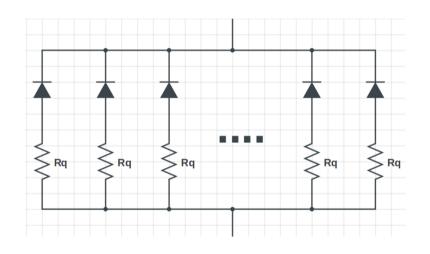
## Proyecto LabOStat

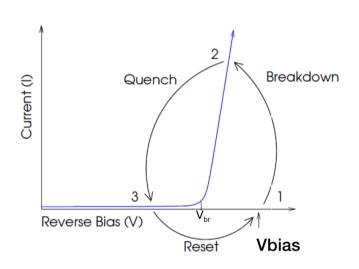
- Labosat es una plataforma para realizar experimentos en órbita.
- Se busca caracterizar fotomultiplicadores de Silicio (SiPM) para la próxima misión espacial.



#### Parámetros a medir:

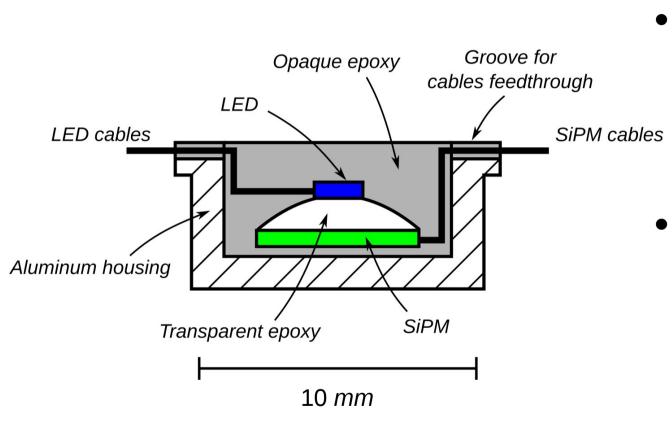
• Resistencia de Quenching: en serie a cada diodo. Encargada de frenar la avalancha de electrones.





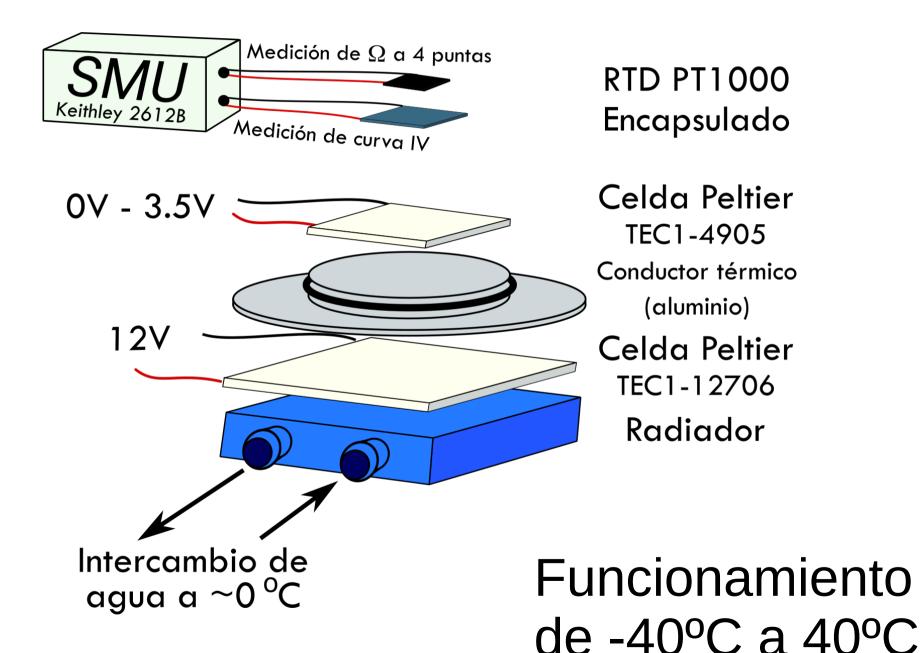
- Voltaje de ruptura del diodo polarizado en inversa.
- Corriente oscura.

## Encapsulado Oscuro



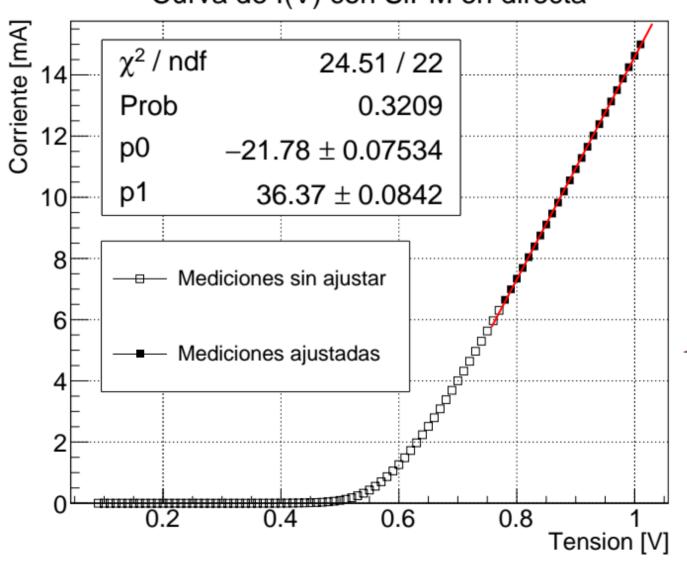
- Configuración más oscura que la s cámara disponible en Labo 6
- Corriente oscura de ~2uA (30V) a temperatura ambiente

## Diseño experimental



## Medición de Rq

Curva de I(V) con SiPM en directa



$$p_1 = \frac{1}{R} = \frac{N}{R_q}$$

$$N = 18980$$

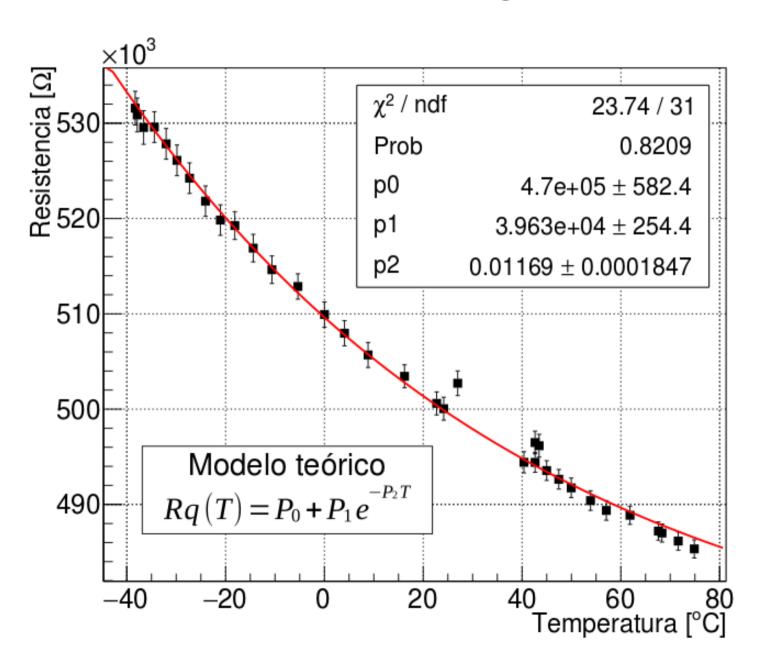
Entonces, por propagación,

$$R_q = (521.86 \pm 1.21)k\Omega$$

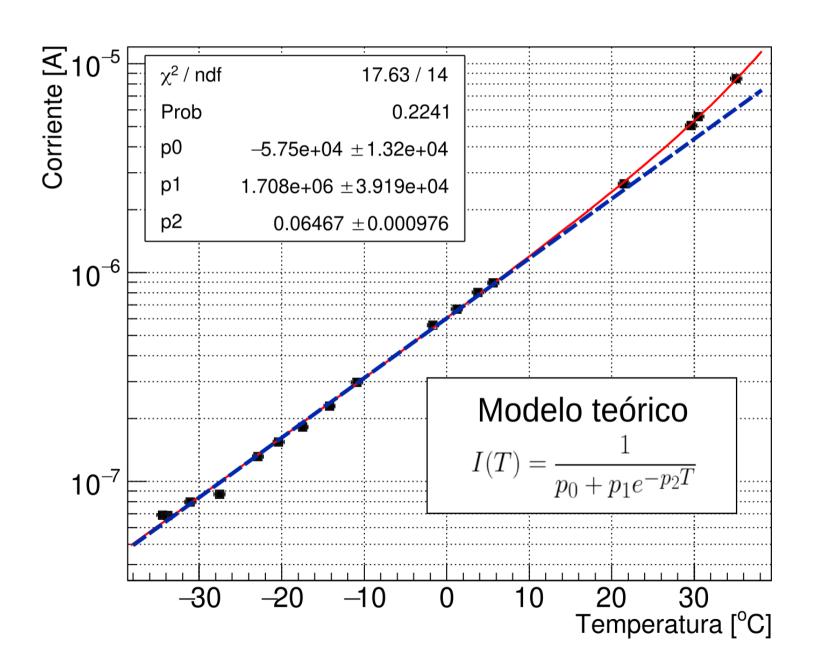
Error relativo:

$$\epsilon \sim 0.2\%$$

## Resistencia de Quenching



### Corriente Oscura a 30V

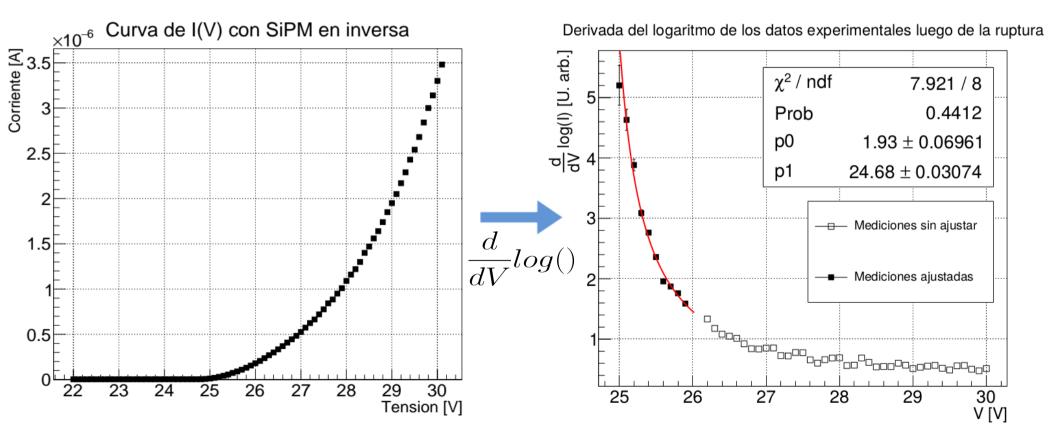


### Tensión de ruptura

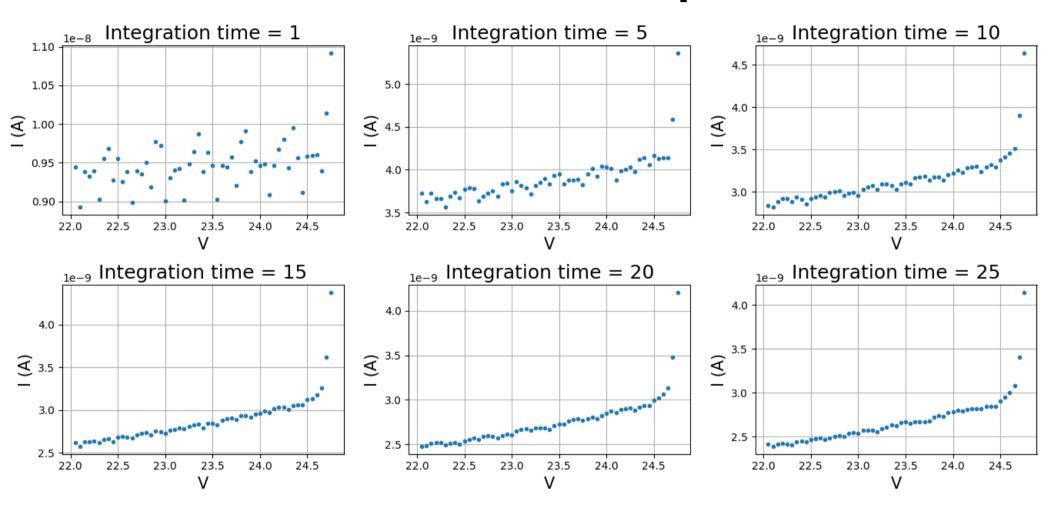
Se observa que el gráfico de la derivada del logaritmo presenta un

máximo en la tensión de ruptura

 $\frac{d}{dV}log(I) \simeq \frac{2}{V - V_{BD}}$ 

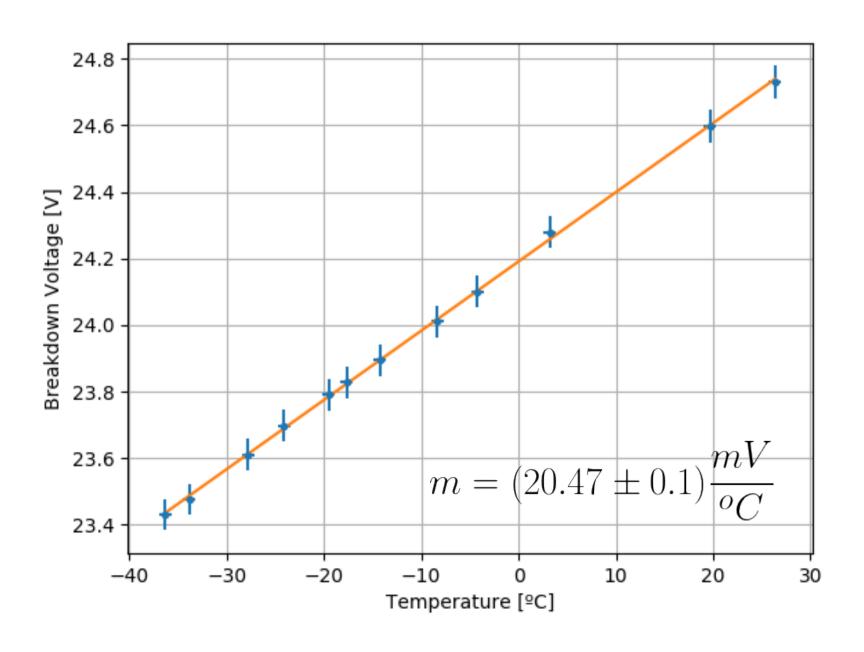


## Tensión de Ruptura



A corrientes pequeñas, se observa un ruido intrínseco del dispositivo que es minimizado al aumentar el tiempo de integración

### Tensión de ruptura



## Experimentos a futuro

- Estudiar en temperatura la respuesta del SiPM al ser iluminado con un led, ya que se observó histeresis en ciertas condiciones con el led prendido.
- Estudiar en temperatura la estabilidad en la corriente del SiPM al ser iluminado con un led tenue.

#### Conclusiones

- Se midió la resistencia de quenching en función de la temperatura y se observó un carácter decreciente y exponencial.
- Se midió la corriente oscura y se observó que su dependencia es lineal para temperaturas bajas.
- Se observó que el voltaje de ruptura presenta un carácter creciente lineal y se obtuvo un valor de la pendiente compatible con el valor del fabricante.